

電子顕微鏡技術情報交流会 第1回 オンライン研修会

「え，知らなかった…」にならないために…

2024年

2.13 Tue START 13:20～
[17:00 終了予定]

定員

先着100名
どなたでもご参加
いただけます

参加費無料

CONTENTS

13:20-14:50 講演1

「日立SEMラインナップと各装置のご紹介」

株式会社 日立ハイテク
コアテクノロジーシステム営業戦略本部 解析企画部
振木 昌成 氏

日立ハイテクは卓上SEMから高分解能FE-SEMまで走査電子顕微鏡を幅広く取り揃えておりますが、製品ラインナップと各装置の特長をご紹介します。

15:20-16:50 講演2

「走査電子顕微鏡(SEM)の最新技術と応用例の紹介」

日本電子株式会社
科学・計測機器営業本部 SI販促 SI技術販促1グループ
作田 裕介 氏

走査電子顕微鏡(SEM)は品質管理から研究開発まで、幅広い用途で用いられ、最近では像分解能がnmオーダーに向上しているだけでなく、様々な分析機器を取り付けることで、試料の凹凸・組成情報だけでなく、3次元情報や結晶情報、化学状態までもが把握できるようになってきています。本講演では、日本電子が手掛けるSEMの最新技術と金属、半導体、高分子、電池、生物における応用例を紹介します。

16:50-

閉会あいさつ

函館工業高等専門学校 技術教育支援センター 松井 春美

[主催] マテリアル先端リサーチインフラ
電子顕微鏡技術情報交流会 オンライン研修会実行委員会
[共催] 日本電子株式会社, 株式会社 日立ハイテク,
大学連携研究設備ネットワーク

◆ お問い合わせ ◆

電子顕微鏡技術情報交流会 オンライン研修会実行委員会
E-mail : denkengijutsu2023_online@googlegroups.com

申し込みはこちら



2/8 締め切り